

Автоматизированный анализ наноразмерных частиц

Аналитический комплекс **SIAMS-CP Nanotech** предлагает группу решений **SIAMS-CP Nanoparticles™** для автоматизированного анализа наноразмерных частиц по их изображениям, полученным методами ПЭМ, РЭМ и АСМ микроскопии.

Решения **SIAMS-CP Nanoparticles™** предназначены для гранулометрического и морфологического анализа наночастиц. Решения имеют ряд специальных возможностей по разделению частиц, их классификации и редактированию.

В результате работы решений автоматически создается отчет об измерениях в формате MS Word®, который включает в себя статистические характеристики результатов измерений параметров наноструктуры, представленные в табличном и графическом представлении. Кроме отчета со статистическими данными, пользователь имеет возможность экспортировать все результаты измерений каждого объекта в MS Excel®.

В группу **SIAMS-CP Nanoparticles™** входят следующие решения:

Анализ размеров и формы наночастиц (АСМ)

Решение предназначено для работы с изображениями, полученными с атомно-силового микроскопа, и служит для измерения различных размерных и морфологических характеристик наночастиц (высота, диаметр, проекции, фактор удлинения и другие).

Анализ размеров наночастиц (РЭМ)

Решение предназначено для измерения характеристик неагломерированных наночастиц по их изображениям, полученным с растрового электронного микроскопа. Решение позволяет проводить фильтрацию объектов на изображении по форме и определять размерные параметры и фактор удлинения наночастиц.

Анализ частиц нанотрубок (ПЭМ)

Решение предназначено для определения гранулометрических характеристик наночастиц в неоднородной с точки зрения анализа среде (например, в нанотрубках). В результате работы решения выдается ряд статистических характеристик распределения размеров наночастиц.

Анализ соприкасающихся частиц (ПЭМ)

Решение предназначено для определения размеров наночастиц в составе агрегатов без значительного перекрытия частиц.

Анализ агломерированных частиц с перекрытием (ПЭМ)

Решение предназначено для определения размеров наночастиц в составе агрегатов. В решении используется усиленный алгоритм разделения частиц для более качественного анализа изображений со значительным перекрытием частиц.

Компания СИАМС обеспечивает полную поддержку клиентов по установке, настройке комплекса решений **SIAMS-CP Nanotech™**, а также производит обучение работе с решениями.

За более подробной информацией обращайтесь:

Компания SIAMS
Тел / Факс: (343) 379-00-34 (35)
E-mail: info@siams.com Web: siams.com

